#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12)公開特許公報 (A)

## (11)特許出願公開番号 特開2003—173026

(P2003-173026A) (43)公開日 平成15年6月20日(2003.6.20)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ		テーマ	'コート' (参考)
G03F 7/039	601	G03F 7/039	601	2H025	
C08F220/18		C08F220/18		4J100	
220/28		220/28			
G03F 7/004	503	G03F 7/004	503	Α	
H01L 21/027		H01L 21/30	502	R	
		審査請求 未請求	請求項の	数1 OL	(全22頁)
(21)出願番号	特願2002-9054(P2002-9054)	(71)出願人 0000041	78		
		ジェイス	Cスアール <sup>®</sup>	株式会社	
(22)出願日	平成14年1月17日(2002.1.17)	東京都中	中央区築地	2丁目11番24	号
		(72)発明者 西村 書	全生		
(31)優先権主張番号	特願2001-10005(P2001-10005)	東京都中	中央区築地:	二丁目11番24	号 ジェイ
(32)優先日	平成13年1月18日(2001.1.18)	エスア-	ール株式会	社内	
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 山本 彩	史		
(31)優先権主張番号	特願2001-303820(P2001-303820)	東京都中	中央区築地:	二丁目11番24	号 ジェイ

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】感放射線性樹脂組成物

#### (57)【要約】

(32)優先日

(33)優先権主張国

【課題】 放射線に対する透明性が高く、感度、解像 度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジスト としての基本物性に優れた感放射線性樹脂組成物を提供 する。

日本(JP)

平成13年9月28日(2001.9.28)

【解決手段】 感放射線性樹脂組成物は、(A)下記式(1)の化合物等で代表されるラクトン基含有複素環構造を有する(メタ)アクリル酸エステル類と、(メタ)アクリル酸 t-プチル、(メタ)アクリル酸 2-メチル-2-アダマンチル、(メタ)アクリル酸 2-Jルボルニル-2-n-プロピル等で代表される酸解離性基含有(メタ)アクリル酸エステル類との共重合体からなる樹脂、並びに(B)1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-<math>n-プタンスルホネート、1-(4-n-プトキシ-1-ナフチル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-<math>n-オクタンスルホネート等で代表される感放射線性酸発生剤を含有する。

【化1】

エスアール株式会社内

弁理士 福沢 俊明

(74)代理人 100100985

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 下記一般式(1) で表される繰返 し単位および下記一般式(2)で表される繰返し単位を 有するアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸解離性 基含有樹脂であって、該酸解離性基が解離したときアル カリ可溶性となる樹脂、並びに(B)下記一般式(3) で表される感放射線性酸発生剤を含有することを特徴と する感放射線性樹脂組成物。

【化1】

〔一般式(1)において、R'およびR'は相互に独立 に水素原子またはメチル基をを示す。一般式(2)にお いて、R'は水素原子またはメチル基を示し、各R'は 相互に独立に炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のア ルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素 基もしくはその誘導体を示すか、あるいは何れか2つの R'が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原 子と共に炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もし くはその誘導体を形成し、残りのR'が炭素数1~4の 直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~2 0の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であ る。)

【化2】

$$S_{+}^{+} C_{13}F_{2n+1}SO_{3}^{-}$$
(3)

〔一般式(3)において、R'は炭素数6~20の1価 の芳香族炭化水素基もしくはその誘導体を示し、mは1 8の整数であり、nは0~5の整数である。]

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組 成物に関わり、さらに詳しくは、KrFエキシマレーザ ーあるいはArFエキシマレーザー等の遠紫外線、シン クロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如 き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型 50 レジストとして好適に使用することができる感放射線性 樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加 工の分野においては、より高い集積度を得るために、最 近では0.20 μm以下のレベルでの微細加工が可能な リソグラフィー技術が必要とされている。しかし、従来 のリソグラフィープロセスでは、一般に放射線としてi 線等の近紫外線が用いられているが、この近紫外線で 10 は、サプクオーターミクロンレベルの微細加工が極めて 困難であると言われている。そこで、0.20μm以下 のレベルでの微細加工を可能とするために、より波長の 短い放射線の利用が検討されている。このような短波長 の放射線としては、例えば、水銀灯の輝線スペクトル、 エキシマレーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線 等を挙げることができるが、これらのうち、特にK r F エキシマレーザー (波長248nm) あるいはArFエ キシマレーザー (波長193nm) が注目されている。 このようなエキシマレーザーによる照射に適したレジス 20 トとして、酸解離性官能基を有する成分と放射線の照射 (以下、「露光」という。) により酸を発生する成分 (以下、「酸発生剤」という。) とによる化学増幅効果 を利用したレジスト(以下、「化学増幅型レジスト」と いう。) が数多く提案されている。化学増幅型レジスト としては、例えば、特公平2-27660号公報には、 カルボン酸の t - プチルエステル基またはフェノールの t -プチルカーボナート基を有する重合体と酸発生剤と を含有するレジストが提案されている。このレジスト は、露光により発生した酸の作用により、重合体中に存 在する t - プチルエステル基あるいは t - ブチルカーボ ナート基が解離して、該重合体がカルボキシル基あるい はフェノール性水酸基からなる酸性基を有するようにな

【0003】ところで、従来の化学増幅型レジストの多 くは、フェノール系樹脂をベースにするものであるが、 このような樹脂の場合、放射線として遠紫外線を使用す ると、樹脂中の芳香族環に起因して遠紫外線が吸収され るため、露光された遠紫外線がレジスト被膜の下層部ま で十分に到達できないという欠点があり、そのため露光 量がレジスト被膜の上層部では多く、下層部では少なく なり、現像後のレジストパターンが上部が細く下部にい くほど太い台形状になってしまい、十分な解像度が得ら れないなどの問題があった。その上、現像後のレジスト パターンが台形状となった場合、次の工程、即ちエッチ ングやイオンの打ち込みなどを行う際に、所望の寸法精 度が達成できず、問題となっていた。しかも、レジスト パターン上部の形状が矩形でないと、ドライエッチング によるレジストの消失速度が速くなってしまい、エッチ ング条件の制御が困難になる問題もあった。一方、レジ

り、その結果、レジスト被膜の露光領域がアルカリ現像

液に易溶性となる現象を利用したものである。

ストパターンの形状は、レジスト被膜の放射線透過率を 高めることにより改善することができる。例えば、ポリ メチルメタクリレートに代表される(メタ)アクリレー ト系樹脂は、遠紫外線に対しても透明性が高く、放射線 透過率の観点から非常に好ましい樹脂であり、例えば特 開平4-226461号公報には、メタクリレート系樹 脂を使用した化学増幅型レジストが提案されている。し かしながら、この組成物は、微細加工性能の点では優れ ているものの、芳香族環をもたないため、ドライエッチ ング耐性が低いという欠点があり、この場合も高精度の 10 エッチング加工を行うことが困難であり、放射線に対す る透明性とドライエッチング耐性とを兼ね備えたものと は言えない。

【0004】また、化学増幅型レジストについて、放射 線に対する透明性を損なわないで、ドライエッチング耐 性を改善する方策の一つとして、レジスト中の樹脂成分 に、芳香族環に代えて脂肪族環を導入する方法が知られ ており、例えば特開平7-234511号公報には、脂 肪族環を有する(メタ)アクリレート系樹脂を使用した 化学増幅型レジストが提案されている。しかしながら、 このレジストでは、樹脂成分が有する酸解離性官能基と して、従来の酸により比較的解離し易い基(例えば、テ トラヒドロピラニル基等のアセタール系官能基) や酸に より比較的解離し難い基(例えば、tープチルエステル 基、 t ープチルカーボネート基等の t ープチル系官能 基)が用いられており、前者の酸解離性官能基を有する 樹脂成分の場合、レジストの基本物性、特に感度やパタ ーン形状は良好であるが、組成物としての保存安定性に 難点があり、また後者の酸解離性官能基を有する樹脂成 分では、逆に保存安定性は良好であるが、レジストの基 30 本物性、特に感度やパターン形状が損なわれるという欠 点がある。さらに、このレジスト中の樹脂成分には脂肪 族環が導入されているため、樹脂自体の疎水性が非常に 高くなり、基板に対する接着性の面でも問題があった。 また、化学増幅型レジストを用いてレジストパターンを 形成する際には、酸解離性官能基の解離を促進するた め、通常露光後に加熱処理されるが、普通、その加熱温 度が変化するとレジストパターンの線幅もある程度変動 するのが避けられない。しかし、近年における集積回路 素子の微細化を反映して、露光後の加熱温度の変化に対 40 しても線幅の変動(即ち温度依存性)が小さいレジスト の開発も強く求められるようになってきた。

【0005】さらに、化学増幅型レジストにおいては、 酸発生剤がレジストとしての機能に大きな影響を及ぼす ことが知られており、今日では、露光による酸発生の量 子収率が高く、高感度であるなどの理由から、オニウム 塩化合物が化学増幅レジストの酸発生剤として広く使用 されている。前記オニウム塩化合物としては、例えば、 トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネ

モネート、トリフェニルスルホニウムナフタレンスルホ ネート、シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキ シル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート等 が使用されているが、これらの従来のオニウム塩化合物 は、一般に感度の点で満足できず、また感度が比較的高 い場合でも、解像度、パターン形状等を総合したレジス ト性能の点で未だ十分とは言えない。このような状況の 下、集積回路素子における微細化の進行に対応しうる技 術開発の観点から、遠紫外線に代表される短波長の放射 線に適応可能で、放射線に対する透明性が高く、かつ感 度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等の レジストとしての基本物性に優れた化学増幅型レジスト が強く求められている。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、放射 線に対する透明性が高く、感度、解像度、ドライエッチ ング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性 に優れた化学増幅型レジストとして有用な感放射線性樹 脂組成物を提供することにある。

#### 20 [0007]

【課題を解決するための手段】本発明によると、前記課 題は、(A)下記一般式(1)で表される繰返し単位お よび下記一般式(2)で表される繰返し単位を有するア ルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸解離性基含有樹 脂であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶 性となる樹脂、並びに(B)下記一般式(3)で表され る感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放 射線性樹脂組成物、によって達成される。

[0008]

【化3】

【0009】〔一般式(1)において、R'およびR' は相互に独立に水素原子またはメチル基をを示す。一般 式(2)において、R'は水素原子またはメチル基を示 し、各R' は相互に独立に炭素数1~4の直鎖状もしく は分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂 環式炭化水素基もしくはその誘導体を示すか、あるいは 何れか2つのR'が相互に結合して、それぞれが結合し ート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチ 50 ている炭素原子と共に炭素数4~20の2価の脂環式炭

化水素基もしくはその誘導体を形成し、残りのR'が炭 素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または 炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその 誘導体である。〕

[0010]

【化4】

$$S_{+}^{+} C_{n} F_{2n+1} SO_{3}^{-}$$
(3)

(一般式(3) において、R<sup>1</sup> は炭素数6~20の1価 の芳香族炭化水素基もしくはその誘導体を示し、mは1 ~8の整数であり、nは0~5の整数である。]

【0011】以下、本発明について詳細に説明する。

本発明における(A)成分は、前記一般式(1)で表さ れる繰返し単位(以下、「繰返し単位(1)」とい う。) および前記一般式(2) で表される繰返し単位 (以下、「繰返し単位(2)」という。)を有するアル カリ不溶性またはアルカリ難溶性の酸解離性基含有樹脂 であって、該酸解離性基が解離したときアルカリ可溶性 となる樹脂(以下、「樹脂(A)」という。) からな る。ここでいう「アルカリ不溶性またはアルカリ難溶 性」とは、樹脂(A)を含有する感放射線性樹脂組成物 から形成されたレジスト被膜からレジストパターンを形 成する際に採用されるアルカリ現像条件下で、当該レジ スト被膜の代わりに樹脂(A)のみを用いた被膜を現像 した場合に、当該被膜の初期膜厚の50%以上が現像後 30 に残存する性質を意味する。

【0012】繰返し単位(1)において、該繰返し単位 の主鎖炭素原子に結合しているカルボニルオキシ基は、 環中のラクトン基を形成している炭素原子および基R' が結合している炭素原子以外の任意の炭素原子の位置で 結合することができるが、好ましい結合位置は、下記式 (4)に示される位置である。

[0013]

【化5】

【0014】好ましい繰返し単位(1)としては、例え

るカルボニルオキシ基が前記式(4)に示す位置に結合 しており、R¹ が水素原子であるアクリル系繰返し単 位; R'が水素原子であり、主鎖炭素原子に結合してい るカルボニルオキシ基が前記式(4)に示す位置に結合 しており、R¹ がメチル基であるメタクリル系繰返し単 位;R'がメチル基であり、主鎖炭素原子に結合してい るカルボニルオキシ基が前記式(4)に示す位置に結合 しており、R¹ が水素原子であるアクリル系繰返し単 位;R<sup>i</sup>がメチル基であり、主鎖炭素原子に結合してい 10 るカルボニルオキシ基が前記式(4)に示す位置に結合 しており、R¹ がメチル基であるメタクリル系繰返し単 位等を挙げることができる。樹脂(A)において、繰返 し単位(1)は、単独でまたは2種以上が存在すること ができる。繰返し単位(1)は、対応する(メタ)アク リル酸エステルに由来する繰返し単位である。

6

【0015】次に、繰返し単位(2)において、R'の 炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基とし ては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、 i - プロピル基、n - ブチル基、2 - メチルプロピル 基、1-メチルプロピル基、 t-ブチル基等を挙げるこ 20 とができる。これらのアルキル基のうち、特に、メチル 基、エチル基等が好ましい。

【0016】また、R'の炭素数4~20の1価の脂環 式炭化水素基、および何れか2つのR'が相互に結合し て形成した炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基と しては、例えば、ノルボルナン、トリシクロデカン、テ トラシクロドデカン、アダマンタンや、シクロプタン、 シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シ クロオクタン等のシクロアルカン類等に由来する脂環族 環からなる基;これらの脂環族環からなる基を、例え ば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピ ル基、n-プチル基、2-メチルプロピル基、1-メチ ルプロピル基、 t - ブチル基等の炭素数 1~4の直鎖 状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは 1個以上で置換した基等を挙げることができる。これら の1価または2価の脂環式炭化水素基のうち、ノルボル ナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンまたは アダマンタンに由来する脂環族環からなる基や、これら の脂環族環からなる基を前記アルキル基で置換した基等 40 が好ましい。

【0017】また、前記1価または2価の脂環式炭化水 素基の誘導体としては、例えば、ヒドロキシル基;カル ボキシル基;ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチ ル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピ ル基、2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロ ピル基、1-ヒドロキシプチル基、2-ヒドロキシブチ ル基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル 基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基:メトキシ 基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ ば、R'が水素原子であり、主鎖炭素原子に結合してい 50 基、n-ブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メ チルプロポキシ基、 t - プトキシ基等の炭素数 1~4の アルコキシル基;シアノ基;シアノメチル基、2-シア ノエチル基、3-シアノプロピル基、4-シアノプチル 基等の炭素数2~5のシアノアルキル基等の置換基を1 種以上あるいは1個以上有する基を挙げることができ る。これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキ シル基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル 基等が好ましい。

【0018】繰返し単位(2)における基-COOC (R¹)、は、酸の作用により解離してカルボキシル基を 10 形成する酸解離性基をなしている。以下では、この基を 酸解離性基(I)という。好ましい酸解離性基(I)の 具体例としては、 t - プトキシカルボニル基や、下記式 (I-I)~(I-45)の基等を挙げることができる。

[0019]

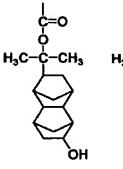
H<sub>3</sub>C-C (I-7)

H<sub>2</sub>C−Ċ

(I-14)

[0024] 【化11】

[0021] 【化8】



(1-11)

(I-12)

[0023] 【化10】

(I-15)

10 -CH₃ -CH<sub>3</sub> CH<sub>3</sub> (I-16)(I-17) (I-18) [0025] (1-30)(1-28)(1-29)【化12】 10 [0029] 【化16】 =0 Ċ=O C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> HÓ NĆ (I-20) (I-19) (I-21) [0026] 【化13】 20 (1-32)(I-33)(I-31) =0 [0030] 【化17】 (I-24) (I-22) (1-23)[0027] 【化14】 HÓ (I-34)(I-35)(I-36) [0031] 【化18】 C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> (I-27) (I-26) (1-25)[0028] 【化15】 (I-37) (1-38)(I-39) [0032] 【化19】

$$CH_3$$
 HO  $CH_3$  NC  $CH_3$  (I-42)

[0033]

$$C_2H_5$$
 HO  $C_2H_5$  HC  $C_2H_5$  (I-43) (I-44) (I-45)

【0034】これらの酸解離性基(I)のうち、t-ブ トキシカルボニル基や、式(I-1)、式(I-2)、式 (I-10)、式(I-11)、式(I-13)、式(I-14)、式 (I-16)、式 (I-17)、式 (I-34)、式 (I-35)、式 (I-40)、式(I-41)、式(I-43)または式(I-44)の 基等が好ましい。繰返し単位(2)は、対応する(メ タ) アクリル酸エステルに由来する繰返し単位である。 【0035】樹脂(A)は、繰返し単位(1)および繰 返し単位(2)以外の繰返し単位(以下、「他の繰返し 単位」という。)を1種以上有することができる。他の 繰返し単位を与える重合性不飽和単量体としては、例え ば、(メタ) アクリル酸ノルボルニル、(メタ) アクリ ル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸トリシクロデカ ニル、(メタ)アクリル酸テトラシクロデカニル、(メ 30 タ) アクリル酸ジシクロペンテニル、(メタ) アクリル 酸アダマンチル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシア ダマンチル、(メタ)アクリル酸アダマンチルメチル等 の有橋式炭化水素骨格を有する(メタ)アクリル酸エス テル類;(メタ)アクリル酸カルボキシノルボルニル、 (メタ) アクリル酸カルポキシトリシクロデカニル、

(メタ) アクリル酸カルボキシテトラシクロデカニル等 の不飽和カルボン酸の有橋式炭化水素骨格を有するカル ボキシル基含有エステル類;

【0036】ノルボルネン(即ち、ビシクロ[2.2.401] ヘプト-2-エン)、5-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-n-プロピルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-n-プチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-n-ペンチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-n-ヘキシルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5ーヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5ーヒドロキシメチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5ーヒドロキンメチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5ーヒドロキンメチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5ーヒドロキンメチルビシクロ[4.4.0.1\*・・.150

(I-45)

(I-47)

(I-45)

(I-47)

(I-48)

(I-48

[4. 4. 0. 1<sup>1.6</sup> . 1<sup>7.10</sup> ]ドデカ-3-エン、8
-エチルテトラシクロ [4. 4. 0. 1<sup>1.6</sup> . 1<sup>7.10</sup> ]
ドデカ-3-エン、8-n-プロピルテトラシクロ
[4. 4. 0. 1<sup>1.6</sup> . 1<sup>7.10</sup> ]ドデカ-3-エン、8
-n-プチルテトラシクロ [4. 4. 0. 1<sup>1.6</sup> . 1
7.10 ]ドデカ-3-エン、8-n-ペンチルテトラシクロ [4. 4. 0. 1<sup>1.6</sup> . 1
7.10 ]ドデカ-3-エン、8-n-ペンチルテトラシクロ [4. 4. 0. 1<sup>1.6</sup> . 1
7.10 ]ドデカ-3-エン、8-ヒドロキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1<sup>1.6</sup> . 1
7.10 ]ドデカ-3-エン、8-ヒドロキシテトラシクロ [4. 4. 0. 1
7.10 ]ドデカ-3-エン、8-ヒドロキシメチルテトラシクロ [4. 4. 0. 1
7.10 ]ドデカ-3-エン、

【0037】8-フルオロテトラシクロ[4.4.0. ルテトラシクロ[4.4.0.11.1 . 17.10]ドデカ -3-エン、8-ジフルオロメチルテトラシクロ[4. 4. 0. 11.6 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、8ートリ フルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1\*.6.1 **7・10** ]ドデカー3ーエン、8ーペンタフルオロエチルテ トラシクロ[ 4. 4. 0. 11.6 . 17.10 ]ドデカー3 ーエン、8,8-ジフルオロテトラシクロ[4.4. 0. 1<sup>3</sup>. 1 1<sup>7.10</sup> ]ドデカー3-エン、8, 9-ジフ 40 ルオロテトラシクロ[4.4.0.11.6.17.10]ド デカー3ーエン、8,8ーピス(トリフルオロメチル) テトラシクロ[4.4.0.13.6.17.10]ドデカー 3-エン、8, 9-ピス(トリフルオロメチル)テトラ シクロ[ 4. 4. 0. 11.1 . 17.10 ]ドデカー3ーエ ン、8-メチル-8-トリフルオロメチルテトラシクロ [ 4. 4. 0. 11.6 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、 【0038】8,8,9-トリフルオロテトラシクロ[ 4. 4. 0. 1<sup>1.1</sup> . 1<sup>1.10</sup> ]ドデカー3ーエン、8, 8, 9-トリス (トリフルオロメチル) テトラシクロ[ 4. 4. 0. 12.6. 17.10 ]ドデカー3-エン、8.

8, 9, 9-テトラフルオロテトラシクロ[4.4.4. 0.  $1^{1.6}$  .  $1^{7.10}$  ]  $| \vec{r} \vec{r} \vec{p} - 3 - \vec{x} \vec{v}$ , 8, 8, 9, 9-テトラキス (トリフルオロメチル) テトラシクロ[ 4. 4. 0.  $1^{1.6}$  .  $1^{7.10}$  ]  $|\vec{r}\vec{r}| - 3 - \text{LV}$ , 8, 8-ジフルオロ-9,9-ビス(トリフルオロメチル) テトラシクロ[ 4. 4. 0. 1<sup>2.1</sup> . 1<sup>7.10</sup> ]ドデカー 3-エン、8, 9-ジフルオロ-8, 9-ビス(トリフ ルオロメチル) テトラシクロ[4.4.0.11.5.1 7.10 ]ドデカー3ーエン、8,8,9ートリフルオロー 9-トリフルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1 <sup>1.6</sup> . 1<sup>7.10</sup> ]ドデカー3ーエン、8, 8, 9ートリフ ルオロー9-トリフルオロメトキシテトラシクロ[4. 4. 0. 1'.' . 1'.'0 ]ドデカー3ーエン、

【0039】8,8,9-トリフルオロ-9-ペンタフ ルオロプロポキシテトラシクロ[4.4.0.11.6]. 17.10 ]ドデカー3ーエン、8-フルオロー8ーペンタ フルオロエチルー9、9ービス(トリフルオロメチル) テトラシクロ[ 4. 4. 0. 1<sup>1.6</sup> . 1<sup>7.10</sup> ]ドデカー 3-エン、8,9-ジフルオロ-8-ヘプタフルオロイ ソプロピルー9ートリフルオロメチルテトラシクロ[ 4. 4. 0. 11.6 . 17.10 ]ドデカー3-エン、8-クロロー8, 9, 9-トリフルオロテトラシクロ[4. 4. 0. 11.5 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、8, 9-ジクロロー8, 9-ビス (トリフルオロメチル) テトラ シクロ[4.4.0.11.6]ドデカー3ーエ ン、8-(2', 2', 2'-トリフルオロカルボエト キシ) テトラシクロ[4.4.0.12.5.17.10]ド デカー3-エン、8-メチル-8-(2', 2', 2' ートリフルオロカルボエトキシ)テトラシクロ[4. 4. 0. 11.1 . 17.10 ]ドデカー3ーエン、 【0040】ジシクロペンタジエン、トリシクロ[5.

2. 1.  $0^{1.6}$  ]  $\vec{r}$ h-8-x $\lambda$ , hy>hpDDDDDD2. 1. 0\*\*\* ] デカー3ーエン、トリシクロ[ 4. 4. 0. 11.6 ] ウンデカー3-エン、トリシクロ[ 6. 2. 1. 0<sup>1.8</sup>] ウンデカー9-エン、トリシクロ [ 6. 2. 1. 0'・ ] ウンデカー4ーエン、テトラシ クロ[4.4.0.11.6.17.10.01.6]ドデカー 3-エン、8-メチルテトラシクロ[4.4.0.1 \*. 6 . 1'. 10 . 0'. 1 ] ドデカー3ーエン、8ーエチリ デンテトラシクロ[ 4. 4. 0.  $1^{1.5}$  .  $1^{7.12}$  ]ドデ 40 n-プロポキシカルボニルー $\gamma-$ ブチロラクトン、 $\alpha-$ カー3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4.4. 0.1'.' .1'.'' .0'.' ] ドデカー3ーエン、ペン タシクロ[6.5.1.13.6.01.7.01.13]ペン タデカー4ーエン、ペンタシクロ[7.4.0.1] \*.\* . 1\*.1 . 0\*.1 ]ペンタデカー3-エン等の有橋 式炭化水素骨格を有する他の単官能性単量体:

【0041】 (メタ) アクリル酸メチル、 (メタ) アク リル酸エチル、(メタ)アクリル酸 n-プロピル、(メ タ) アクリル酸 n - プチル、(メタ) アクリル酸 2 - メ

ル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メ タ) アクリル酸 3-ヒドロキシプロピル、(メタ) アク リル酸シクロプロピル、(メタ)アクリル酸シクロペン チル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)ア クリル酸4-メトキシシクロヘキシル、(メタ)アクリ ル酸2-シクロペンチルオキシカルボニルエチル、(メ タ) アクリル酸 2 - シクロヘキシルオキシカルボニルエ チル、(メタ)アクリル酸2-(4-メトキシシクロへ キシル)オキシカルボニルエチル等の有橋式炭化水素骨 10 格をもたない (メタ) アクリル酸エステル類:

【0042】 $\alpha$ ーヒドロキシメチルアクリル酸メチル、  $\alpha$ ーヒドロキシメチルアクリル酸エチル、 $\alpha$ ーヒドロキ シメチルアクリル酸 n ープロピル、α-ヒドロキシメチ ルアクリル酸 n ープチル等の α ーヒドロキシメチルアク リル酸エステル類: (メタ) アクリロニトリル、α-ク ロロアクリロニトリル、クロトンニトリル、マレインニ トリル、フマロニトリル、メサコンニトリル、シトラコ ンニトリル、イタコンニトリル等の不飽和ニトリル化合 物; (メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチル (メ 20 夕) アクリルアミド、クロトンアミド、マレインアミ ド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミ ド、イタコンアミド等の不飽和アミド化合物;N-(メ タ) アクリロイルモルホリン、N-ビニル-ε-カプロ ラクタム、N-ビニルピロリドン、ビニルピリジン、ビ ニルイミダゾール等の他の含窒素ビニル化合物: (メ タ) アクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、無水マレイ ン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シトラ コン酸、無水シトラコン酸、メサコン酸等の不飽和カル ボン酸 (無水物) 類; (メタ) アクリル酸 2-カルボキ 30 シエチル、(メタ) アクリル酸 2 - カルボキシプロピ ル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシプロピル、(メ タ) アクリル酸 4 - カルボキシブチル、(メタ) アクリ ル酸4-カルボキシシクロヘキシル等の不飽和カルボン 酸の有橋式炭化水素骨格をもたないカルボキシル基含有 エステル類:

 $[0043]\alpha - (y)$ トキシカルボニルー $\gamma$ ープチロラクトン、 $\alpha$ - (メタ) アクリロイルオキシーβ-エトキシカルボニル-γ-ブ チロラクトン、 $\alpha$  - (メタ) アクリロイルオキシ- $\beta$  -(メタ) アクリロイルオキシーβ-i-プロポキシカル ボニルー γ ープチロラクトン、α ー (メタ) アクリロイ ルオキシーβ-n-プトキシカルポニル-γ-プチロラ クトン、 $\alpha$  - (メタ) アクリロイルオキシ- $\beta$  - (2 -メチルプロポキシ) カルボニル-γ-ブチロラクトン、  $\alpha - (\lambda \beta) P \cap (1 - \lambda \beta) P \cap$ ロポキシ) カルボニルーγープチロラクトン、αー (メ タ) アクリロイルオキシ-β-t-プトキシカルポニル - γ - プチロラクトン、α - (メタ) アクリロイルオキ チルプロピル、(メタ)アクリル酸 2-ヒドロキシエチ 50 シー $\beta-$ シクロヘキシルオキシカルボニルー $\gamma-$ ブチロ

クリロイルオキシーィープチロラクトン、α-エトキシ カルボニル-β-(メタ)アクリロイルオキシーィープ チロラクトン、 $\alpha-n-$ プロポキシカルボニル $-\beta-$ (メタ) アクリロイルオキシー γ - プチロラクトン、α - i - プロポキシカルボニル-β-(メタ)アクリロイ 20 ルオキシーγープチロラクトン、α-n-プトキシカル ポニルーβー (メタ) アクリロイルオキシーγープチロ ラクトン、α-(2-メチルプロポキシ)カルボニルβ-(メタ) アクリロイルオキシ-γ-プチロラクト ン、α-(1-メチルプロポキシ)カルボニル-β-(メタ) アクリロイルオキシー $\gamma$ -ブチロラクトン、 $\alpha$ - t - プトキシカルボニル-β- (メタ) アクリロイル オキシ-γ-プチロラクトン、α-シクロヘキシルオキ シカルポニルーβー (メタ) アクリロイルオキシーィー プチロラクトン、α-(4-t-プチルシクロヘキシル 30 オキシ) カルボニルーβー (メタ) アクリロイルオキシ - γ - プチロラクトン、α - フェノキシカルボニル - β (メタ) アクリロイルオキシーγープチロラクトン、  $\alpha - (1 - x + x + y + x + y)$ タ) アクリロイルオキシーγープチロラクトン、α-(1-シクロヘキシルオキシエトキシ) カルボニル-β ー(メタ)アクリロイルオキシーィープチロラクトン、 α-t-プトキシカルボニルメトキシカルボニル-β-**(メタ)アクリロイルオキシーァープチロラクトン、α** ーテトラヒドロフラニルオキシカルボニルーβー (メ **タ)アクリロイルオキシーγープチロラクトン、αーテ** トラヒドロピラニルオキシカルボニル-β-(メタ)ア クリロイルオキシーィープチロラクトン等の酸解離性基 を有する(メタ)アクリロイルオキシラクトン化合物: 【0045】α-(メタ) アクリロイルオキシ-γ-ブ チロラクトン、α-(メタ) アクリロイルオキシーβ-フルオローγープチロラクトン、αー(メタ)アクリロ イルオキシーβーヒドロキシー $\gamma$ ープチロラクトン、 $\alpha$ (メタ) アクリロイルオキシーβーメチルーγープチ ロラクトン、α-(メタ)アクリロイルオキシ-β-エ 50

チルーγープチロラクトン、αー(メタ) アクリロイル オキシー $\beta$ ,  $\beta$  -ジメチルー $\gamma$  -ブチロラクトン、 $\alpha$  -(メタ) アクリロイルオキシーβ-メトキシーγ-プチ ロラクトン、β-(メタ) アクリロイルオキシーγ-ブ チロラクトン、 $\alpha$ -フルオロ- $\beta$ -(メタ) アクリロイ ルオキシー $\gamma$ -プチロラクトン、 $\alpha$ -ヒドロキシー $\beta$ -(メタ) アクリロイルオキシー γ - プチロラクトン、α ーメチルーβー (メタ) アクリロイルオキシーィープチ ロラクトン、α-エチル-β-(メタ) アクリロイルオ 10 キシー $\gamma$ -プチロラクトン、 $\alpha$ ,  $\alpha$ -ジメチル- $\beta$ -(メタ) アクリロイルオキシー γ - プチロラクトン、α -メトキシーβー(メタ)アクリロイルオキシーγープ チロラクトン、αー(メタ)アクリロイルオキシーδー メバロノラクトン等の酸解離性基をもたない(メタ)ア クリロイルオキシラクトン化合物;前記不飽和カルボン 酸類あるいは前記不飽和カルボン酸の有橋式炭化水素骨 格をもたないカルボキシル基含有エステル類のカルボキ シル基を、下記する酸解離性基(i)に変換した化合物 等の単官能性単量体や、

16

【0046】1,2-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,3-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、トリシクロデカニルジメチロールジ(メタ)アクリレート等の有橋式炭化水素骨格を有する多官能性単量体;

【0047】メチレングリコールジ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、2,5-ジメチル-2,5-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,8-オクタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4-ビス(2-ヒドロキシプロピル)ベンゼンジ(メタ)アクリレート、1,3-ビス(2-ヒドロキシプロピル)ベンゼンジ(メタ)アクリレート、1,3-ビス(2-ヒドロキシプロピル)ベンゼンジ(メタ)アクリレート等の有橋式炭化水素骨格をもたない多官能性単量体等の多官能性単量体を挙げることができる。

【0048】樹脂(A)において、繰返し単位(1)の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、10~80モ40 ル%、好ましくは20~70モル%、さらに好ましくは30~70モル%である。この場合、繰返し単位(1)の含有率が10モル%未満では、レジストとしたときの現像性や基板への接着性が低下する傾向があり、一方80モル%を超えると、レジストとしての解像度が低下する傾向がある。また、繰返し単位(2)の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、10~80モル%、好ましくは20~70モル%、さらに好ましくは20~60モル%である。この場合、繰返し単位(2)の含有率が10モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する50傾向があり、一方80モル%を超えると、レジストとし

たとき現像性が低下したり、スカムが発生しやすくなる傾向がある。また、他の繰返し単位の含有率は、全繰返し単位に対して、通常、50モル%以下、好ましくは40モル%以下である。

【0049】樹脂(A)は、例えば、その各繰返し単位 に対応する重合性不飽和単量体を、ヒドロパーオキシド 類、ジアルキルパーオキシド類、ジアシルパーオキシド 類、アゾ化合物等のラジカル重合開始剤を使用し、必要 に応じて連鎖移動剤の存在下、適当な溶媒中で重合する ことにより製造することができる。前記重合に使用され 10 る溶媒としては、例えば、n-ペンタン、n-ヘキサ ン、nーヘプタン、nーオクタン、nーノナン、nーデ カン等のアルカン類;シクロヘキサン、シクロヘプタ ン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナン等のシク ロアルカン類;ベンゼン、トルエン、キシレン、エチル ベンゼン、クメン等の芳香族炭化水素類;クロロブタン 類、プロモヘキサン類、ジクロロエタン類、ヘキサメチ レンジプロミド、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水 素類;酢酸エチル、酢酸 n - プチル、酢酸 i - プチル、 プロピオン酸メチル等の飽和カルボン酸エステル類;テ 20 トラヒドロフラン、ジメトキシエタン類、ジエトキシエ タン類、プロピレングリコールモノメチルエーテル等の エーテル類や、プロピレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート、メチルエチルケトン等を挙げることがで きる。これらの溶媒は、単独でまたは2種以上を混合し て使用することができる。また、前記重合における反応 温度は、通常、40~120℃、好ましくは50~90 ℃であり、反応時間は、通常、1~48時間、好ましく は1~24時間である。

【0050】樹脂(A)のゲルパーミエーションクロマ 30 トグラフィ (GPC) によるポリスチレン換算重量平均 分子量(以下、「Mw」という。)は、通常、3,00 0~30,000、好ましくは5,000~30,00 0、さらに好ましくは5,000~20,000であ る。この場合、樹脂(A)のMwが3,000未満で は、レジストとしたときの耐熱性が低下する傾向があ り、一方30,000を超えると、レジストとしたとき の現像性が低下する傾向がある。また、樹脂(A)のM wとゲルパーミエーションクロマトグラフィ(GPC) によるポリスチレン換算数平均分子量(以下、「Mn」 という。) との比 (Mw/Mn) は、通常、1~5、好 ましくは1~3である。なお、樹脂(A)は、ハロゲ ン、金属等の不純物が少ないほど好ましく、それによ り、レジストとしたときの感度、解像度、プロセス安定 性、パターン形状等をさらに改善することができる。樹 脂(A)の精製法としては、例えば、水洗、液々抽出等 の化学的精製法や、これらの化学的精製法と限外ろ過、 遠心分離等の物理的精製法との組み合わせ等を挙げるこ とができる。

【0051】酸発生剤(B)

本発明における(B)成分は、前記一般式(3)で表される感放射線性酸発生剤(以下、「酸発生剤(B)」という。)からなり、露光により酸を発生する化合物である。酸発生剤(B)は、露光により発生した酸の作用によって、樹脂(A)中に存在する酸解離性基を解離させ、その結果レジスト被膜の露光部がアルカリ現像液に易溶性となり、ポジ型のレジストパターンを形成する作用を有するものである。

【0052】一般式(3)において、R<sup>f</sup> の炭素数6~ 20の1価の芳香族炭化水素基としては、例えば、フェ ニル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、 2, 3-ジメチルフェニル基、2, 4-ジメチルフェニ ル基、2,5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメチル フェニル基、3,4-ジメチルフェニル基、3,5-ジ メチルフェニル基、2,4,6-トリメチルフェニル 基、4-エチルフェニル基等のフェニル基または炭素数 1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基で置換され たフェニル基;1-ナフチル基、2-メチル-1-ナフ チル基、3-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1 -ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、5-メチ ルー1-ナフチル基、6-メチル-1-ナフチル基、7 -メチル-1-ナフチル基、8-メチル-1-ナフチル 基、2,3-ジメチル-1-ナフチル基、2,4-ジメ チルー1-ナフチル基、2,5-ジメチルー1-ナフチ ル基、2,6-ジメチル-1-ナフチル基、2,7-ジ メチルー1ーナフチル基、2,8-ジメチルー1ーナフ チル基、3,4-ジメチル-1-ナフチル基、3,5-ジメチル-1-ナフチル基、3,6-ジメチル-1-ナ フチル基、3,7-ジメチル-1-ナフチル基、3,8 -ジメチル-1-ナフチル基、4,5-ジメチル-1-ナフチル基、5,8-ジメチル-1-ナフチル基、4-エチルー1ーナフチル基2ーナフチル基、1ーメチルー 2-ナフチル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メ チルー2-ナフチル基等のナフチル基またはメチル基も しくはエチル基で置換されたナフチル基等を挙げること ができる。

【0053】また、前記芳香族炭化水素基の誘導体における置換基としては、ヒドロキシル基;カルボキシル基;ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、20-ヒドロキシエチル基、3-ヒドロキシプロピル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のヒドロキシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-プトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、t-ブトキシ基等の炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基;メトキシメトキシ基、i-プロポキシメトキシ基、n-プロポキシメトキシ基、i-プロポキシメトキシ基、n-プトキシメトキシ基、t-ブトキシメトキシ基等の炭素数2~5の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシメトキシ基;1-メトキシエトキシ基、

1-エトキシエトキシ基、1-n-プロポキシエトキシ 基、1-i-プロポキシエトキシ基、1-n-プトキシ エトキシ基、1-t-プトキシエトキシ基等の炭素数3 ~6の直鎖状もしくは分岐状の1-アルコキシエトキシ 基;2-メトキシエトキシ基、2-エトキシエトキシ 基、2-n-プロポキシエトキシ基、2-i-プロポキ シエトキシ基、2-n-プトキシエトキシ基、2-t-プトキシエトキシ基等の炭素数3~6の直鎖状もしくは 分岐状の2-アルコキシエトキシ基:メトキシカルボニ ルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、n-プロポ 10 キシカルボニルオキシ基、i-プロポキシカルボニルオ キシ基、n-プトキシカルポニルオキシ基、t-プトキ シカルボニルオキシ基等の炭素数2~5の直鎖状もしく は分岐状のアルコキシカルポニルオキシ基;ベンジルオ キシ基、フェネチルオキシ基等の炭素数7~12のアラ ルキルオキシ基;フェニルアセトメチル基、1-ナフチ ルアセトメチル基等の炭素数9~15のアリールアセト メチル基: 2-テトラヒドロフラニルオキシ基、2-テ トラヒドロピラニルオキシ基等の酸素原子含有基や、シ アノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロピ 20 ル基、4-シアノブチル基等の窒素原子含有基等を挙げ ることができる。

19

【0054】R\*の炭素数6~20の1価の芳香族炭化 水素基およびその誘導体としては、3,5-ジメチルー 4-ヒドロキシフェニル基、4-メトキシフェニル基、 4-n-プトキシフェニル基、2,4-ジメトキシフェ ニル基、3,5-ジメトキシフェニル基、4-n-プト キシー1-ナフチル基等が好ましい。一般式(3)にお いて、mとしては、特に4または8が好ましく、nとし ては、特に1が好ましい。一般式(3)における基C。 F: u+1 は、炭素数mのパーフルオロアルキル基である が、該基は直鎖状もしくは分岐状であることができる。 【0055】好ましい酸発生剤(B)としては、例え ば、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンス ルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシ フェニル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n-プタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4 ーヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムパ ーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(4-n 40 ープトキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムトリ フルオロメタンスルホネート、1-(4-n-プトキシ フェニル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n-プタンスルホネート、1-(4-n-プトキシフェ ニル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオローn-オクタンスルホネート、1-(4-ヒドロキシ-1-ナ フチル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、1-(4-ヒドロキシ-1-ナフチ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブ タンスルホネート、1-(4-ヒドロキシ-1-ナフチ 50 ネート、1-(4-メトキシカルボニルオキシ-1-ナ

ル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n-オ クタンスルホネート、1-(4-メトキシー1-ナフチ ル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンス ルホネート、1-(4-メトキシ-1-ナフチル)テト ラヒドロチオフェニウムノナフルオローnープタンスル ホネート、1-(4-メトキシ-1-ナフチル)テトラ ヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタンスル ホネート、

【0056】1-(4-エトキシ-1-ナフチル)テト ラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、1-(4-エトキシ-1-ナフチル)テトラヒドロ チオフェニウムノナフルオロ-n-プタンスルホネー ト、1-(4-エトキシ-1-ナフチル)テトラヒドロ チオフェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネー ト、1-(4-n-プトキシ-1-ナフチル)テトラヒ ドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、 1-(4-n-プトキシ-1-ナフチル)テトラヒドロ チオフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホネー ト、1-(4-n-プトキシ-1-ナフチル)テトラヒ ドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタンスルホ ネート、1-(4-メトキシメトキシ-1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホ ネート、1-(4-メトキシメトキシ-1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-プタン スルホネート、1-(4-メトキシメトキシ-1-ナフ チル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオローn-オクタンスルホネート、1-(4-エトキシメトキシー 1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、1-(4-エトキシメトキシー 1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオ ローn-プタンスルホネート、1-(4-エトキシメト キシー1ーナフチル) テトラヒドロチオフェニウムパー フルオローnーオクタンスルホネート、1-〔4-(1 ーメトキシエトキシ) -1-ナフチル) テトラヒドロチ オフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-[4-(1-メトキシエトキシ)-1-ナフチル]テト ラヒドロチオフェニウムノナフルオローnープタンスル ホネート、1-〔4-(1-メトキシエトキシ)-1-ナフチル〕テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n-オクタンスルホネート、

[0057]1-[4-(2-1)+2+2+2+2)-1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロ メタンスルホネート、1-〔4-〔2-メトキシエトキ シ) -1-ナフチル] テトラヒドロチオフェニウムノナ フルオローnープタンスルホネート、1-〔4-〔2-メトキシエトキシ) -1-ナフチル] テトラヒドロチオ フェニウムパーフルオロー n ーオクタンスルホネート、 1-(4-メトキシカルポニルオキシ-1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホ

フチル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n -プタンスルホネート、1-(4-メトキシカルボニル オキシー1ーナフチル) テトラヒドロチオフェニウムパ ーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(4-エ トキシカルポニルオキシー1ーナフチル) テトラヒドロ チオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-エトキシカルボニルオキシ-1-ナフチル)テト ラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-プタンスル ホネート、1-(4-エトキシカルボニルオキシ-1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー 10 n-オクタンスルホネート、1-(4-n-プロポキシ カルボニルオキシ-1-ナフチル) テトラヒドロチオフ ェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4n-プロポキシカルボニルオキシ-1-ナフチル)テト ラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-プタンスル ホネート、1-(4-n-プロポキシカルボニルオキシ -1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムパーフル オローnーオクタンスルホネート、

【0058】1-(4-i-プロポキシカルボニルオキ ルオロメタンスルホネート、1 - (4 - i - プロポキシ カルボニルオキシー1ーナフチル) テトラヒドロチオフ ェニウムノナフルオロ-n-プタンスルホネート、1-(4-i-プロポキシカルボニルオキシ-1-ナフチ ル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオ クタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシカルボニ ルオキシー1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウム トリフルオロメタンスルホネート、1-(4-n-プト キシカルボニルオキシー1-ナフチル) テトラヒドロチ オフェニウムノナフルオローnープタンスルホネート、 1-(4-n-プトキシカルボニルオキシ-1-ナフチ ル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オ クタンスルホネート、1-(4-t-プトキシカルボニ ルオキシー1ーナフチル) テトラヒドロチオフェニウム トリフルオロメタンスルホネート、1 - (4 - t - プト キシカルポニルオキシー1-ナフチル) テトラヒドロチ オフェニウムノナフルオローnープタンスルホネート、 1-(4-t-プトキシカルポニルオキシ-1-ナフチ ル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オ クタンスルホネート、

【0059】1-(4-ベンジルオキシ-1-ナフチ ル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンス ルホネート、1-(4-ベンジルオキシ-1-ナフチ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-プ タンスルホネート、1-(4-ベンジルオキシ-1-ナ フチル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n ーオクタンスルホネート、1-(1-ナフチルアセトメ チル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタン スルホネート、1~(1-ナフチルアセトメチル)テト

ホネート、1-(1-ナフチルアセトメチル)テトラヒ ドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタンスルホ ネート、1-〔4-(2-テトラヒドロフラニルオキ シ) -1-ナフチル] テトラヒドロチオフェニウムトリ フルオロメタンスルホネート、1~〔4~(2-テトラ ヒドロフラニルオキシ) -1-ナフチル) テトラヒドロ チオフェニウムノナフルオローn-プタンスルホネー ト、1-〔4-(2-テトラヒドロフラニルオキシ)-1-ナフチル〕テトラヒドロチオフェニウムパーフルオ ローnーオクタンスルホネート、1-〔4-(2-テト ラヒドロピラニルオキシ) -1-ナフチル] テトラヒド ロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1 - (4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ)-1-ナ フチル〕 テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n ープタンスルホネート、1-〔4-〔2-テトラヒドロ ピラニルオキシ) - 1 - ナフチル) テトラヒドロチオフ ェニウムパーフルオロー n - オクタンスルホネート等を 挙げることができる。

【0060】これらの好ましい酸発生剤(B)のうち、 シー1-ナフチル)テトラヒドロチオフェニウムトリフ 20 特に、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブ タンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒド ロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムパーフル オロー n ーオクタンスルホネート、1 ー (4 ーヒドロキ シー1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムノナフ ルオロ-n-プタンスルホネート、1-(4-ヒドロキ シー1-ナフチル) テトラヒドロチオフェニウムパーフ ルオローn-オクタンスルホネート、1-(4-n-プ トキシー1ーナフチル) テトラヒドロチオフェニウムノ ナフルオロー n ープタンスルホネート、1 ー (4-n-プトキシー1ーナフチル) テトラヒドロチオフェニウム パーフルオローn-オクタンスルホネート、1-(1-ナフチルアセトメチル) テトラヒドロチオフェニウムノ ナフルオロー n ープタンスルホネート、1 ー (1 ーナフ チルアセトメチル) テトラヒドロチオフェニウムパーフ ルオローn-オクタンスルホネート等が好ましい。本発 明において、酸発生剤(B)は、単独でまたは2種以上 を混合して使用することができる。

> 【0061】本発明においては、酸発生剤(B)と共 40 に、他の感放射線性酸発生剤(以下、「酸発生剤

(b)」という。)を併用することができる。酸発生剤 (b) としては、例えば、オニウム塩化合物、ハロゲン 含有化合物、ジアゾケトン化合物、スルホン化合物、ス ルホン酸化合物等を挙げることができる。これらの酸発 生剤(b)の例としては、下記のものを挙げることがで きる。

【0062】オニウム塩化合物:オニウム塩化合物とし ては、例えば、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホス ホニウム塩、ジアゾニウム塩、ピリジニウム塩等を挙げ ラヒドロチオフェニウムノナフルオローnープタンスル 50 ることができる。好ましいオニウム塩化合物としては、

ルクロリド、2, 3, 4, 4'ーテトラヒドロキシベン ゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジド-4-スル ホン酸エステルまたは1,2-ナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸エステル、1,1,1-トリス(4-ヒ

ドロキシフェニル) エタンの1, 2-ナフトキノンジア ジドー4-スルホン酸エステルまたは1、2-ナフトキ ノンジアジドー5-スルホン酸エステル等を挙げること

ができる。

【0064】スルホン化合物:スルホン化合物として ルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム 10 は、例えば、 $\beta$  - ケトスルホン、 $\beta$  - スルホニルスルホ ンや、これらの化合物のα-ジアゾ化合物等を挙げるこ とができる。好ましいスルホン化合物としては、例え ば、4-トリスフェナシルスルホン、メシチルフェナシ ルスルホン、ピス(フェニルスルホニル)メタン等を挙 げることができる。

> スルホン酸化合物:スルホン酸化合物としては、例え ば、アルキルスルホン酸エステル、アルキルスルホン酸 イミド、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールス ルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げること ば、ベンゾイントシレート、ピロガロールのトリス(ト リフルオロメタンスルホネート)、ニトロベンジルー 9,10-ジエトキシアントラセン-2-スルホネー ト、トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2. 1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボジイミド、ノ ナフルオローnープタンスルホニルビシクロ[2.2. 1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、パ ーフルオローnーオクタンスルホニルビシクロ[2. 2. 1 ] ヘプトー5-エンー2, 3-ジカルボジイミ ド、N-ヒドロキシスクシイミドトリフルオロメタンス ルホネート、Nーヒドロキシスクシイミドノナフルオロ -n-プタンスルホネート、N-ヒドロキシスクシイミ ドパーフルオローn-オクタンスルホネート、1,8-ナフタレンジカルポン酸イミドトリフルオロメタンスル ホネート、1,8-ナフタレンジカルボン酸イミドノナ フルオローnープタンスルホネート、1、8-ナフタレ ンジカルボン酸イミドパーフルオローnーオクタンスル ホネート等を挙げることができる。

【0065】これらの酸発生剤(b)のうち、ジフェニ 40 ルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフ ェニルヨードニウムノナフルオローnープタンスルホネ ート、ジフェニルヨードニウムパーフルオローnーオク タンスルホネート、ビス (4-t-プチルフェニル) ヨ ードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ピス (4) - t -プチルフェニル) ヨードニウムノナフルオロ-n -プタンスルホネート、ピス (4 - t -プチルフェニ ル) ヨードニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネ ート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロー

例えば、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンス ルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオローn ブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフ ルオロ-n-オクタンスルホネート、ピス(4-t-ブ チルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスルホ ネート、ピス (4 - t - プチルフェニル) ヨードニウム ノナフルオロ-n-プタンスルホネート、ピス (4-t -プチルフェニル) ヨードニウムパーフルオロ-n-オ クタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムトリフ ノナフルオロ-n-プタンスルホネート、トリフェニル スルホニウムパーフルオローnーオクタンスルホネー ト、トリフェニルスルホニウム 10-カンファースル ホネート、シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシル ・メチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、ジシクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、2-オキソ シクロヘキシルジメチルスルホニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、1-ナフチルジメチルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、1-ナフチルジエチル 20 ができる。好ましいスルホン酸化合物としては、例え スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-シ アノー1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロ メタンスルホネート、4-二トロ-1-ナフチルジメチ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-メチル-1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、4-シアノ-1-ナフチルジエ チルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4 -ニトロ-1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフル オロメタンスルホネート、4-メチル-1-ナフチルジ エチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、 4-ヒドロキシー1-ナフチルジメチルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート等を挙げることができ

【0063】ハロゲン含有化合物:ハロゲン含有化合物 としては、例えば、ハロアルキル基含有炭化水素化合 物、ハロアルキル基含有複素環式化合物等を挙げること ができる。好ましいハロゲン含有化合物としては、例え ば、フェニルピス(トリクロロメチル)-s-トリアジ ン、4-メトキシフェニルピス(トリクロロメチル)s - トリアジン、1 - ナフチルピス(トリクロロメチ ル) - s - トリアジン等の(トリクロロメチル) - s -トリアジン誘導体や、1,1-ビス(4-クロロフェニ ル) -2, 2, 2-トリクロロエタン等を挙げることが

ジアゾケトン化合物:ジアゾケトン化合物としては、例 えば、1,3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジアゾベン ゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等を挙げる ことができる。好ましいジアゾケトンとしては、例え ば、1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニルク ロリド、1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニ 50 n-プタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムパ

ーフルオローnーオクタンスルホネート、シクロヘキシル・2ーオキソシクロヘキシル・メチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘキシル・2ーオキソシクロヘキシルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、2ーオキソシクロヘキシルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーヒドロキシー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、

【0066】トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボジイ10ミド、ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボジイミド、パーフルオロ-n-オクタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボジイミド、パーフルオロ-n-オクタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボジイミド、N-ヒドロキシスクシイミドトリフルオロメタンスルホネート、N-ヒドロキシスクシイミドノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、N-ヒドロキシスクシイミドパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1,8-ナフタレンジカルボン酸イミドトリフルオロメタンスルホネート等が好ましい。前記酸発生剤(b)は、単20独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

【0067】本発明の感放射線性樹脂組成物において、酸発生剤(B)と酸発生剤(b)の合計使用量は、レジストとしての感度および現像性を確保する観点から、樹脂(A)100重量部に対して、通常、0.1~20重量部、好ましくは0.5~10重量部である。この場合、前記合計使用量が0.1重量部未満では、感度および現像性が低下する傾向があり、一方20重量部を超えると、放射線に対する透明性が低下して、矩形のレジストパターンを得られ難くなる傾向がある。また、酸発生 30剤(b)の使用割合は、酸発生剤(B)と酸発生剤

(b) との合計100重量部に対して、通常、80重量 %以下、好ましくは60重量%以下である。この場合、 酸発生剤(b)の使用割合が80重量%を超えると、本 発明の所期の効果が損なわれるおそれがある。

【0068】本発明の感放射線性樹脂組成物には、露光により酸発生剤(B)や酸発生剤(b)から生じる酸のレジスト被膜中における拡散現象を制御し、非露光領域における好ましくない化学反応を抑制する作用を有する酸拡散制御剤を配合することが好ましい。このような酸拡散制御剤を配合することにより、得られる感放射線性樹脂組成物の貯蔵安定性がさらに向上し、またレジストとしての解像度がさらに向上するとともに、露光から現像処理までの引き置き時間(PED)の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性に極めて優れた組成物が得られる。酸拡散制御剤としては、レジストパターンの形成工程中の露光や加熱処理により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。このような含窒素有機化合物としては、例えば、下記一般式(5)

[0069] [化21]

### R<sup>6</sup> R<sup>6</sup>—N—R<sup>6</sup> (5)

〔一般式(5)において、各R<sup>6</sup>は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、置換もしくは非置換のアリール基または置換もしくは非置換のアラルキル基を示す。〕

【0070】で表される化合物(以下、「含窒素化合物(イ)」という。)、同一分子内に窒素原子を2個有する化合物(以下、「含窒素化合物(ロ)」という。)、窒素原子を3個以上有するポリアミノ化合物や重合体(以下、これらをまとめて「含窒素化合物(ハ)」という。)、アミド基含有化合物、ウレア化合物、含窒素複素環化合物等を挙げることができる。

【0071】含窒素化合物(イ)としては、例えば、n -ヘキシルアミン、n-ヘプチルアミン、n-オクチル アミン、n-ノニルアミン、n-デシルアミン、シクロ ヘキシルアミン等のモノ (シクロ) アルキルアミン類; ジーnープチルアミン、ジーnーペンチルアミン、ジー n-ヘキシルアミン、ジーn-ヘプチルアミン、ジーn ーオクチルアミン、ジーnーノニルアミン、ジーnーデ シルアミン、シクロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘ キシルアミン等のジ(シクロ)アルキルアミン類:トリ エチルアミン、トリーnープロピルアミン、トリーn-プチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnー ヘキシルアミン、トリーnーヘプチルアミン、トリーn ーオクチルアミン、トリーnーノニルアミン、トリーn ーデシルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、メチ ルジシクロヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン 等のトリ(シクロ)アルキルアミン類:アニリン、N-メチルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチ ルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリ ン、4-二トロアニリン、ジフェニルアミン、トリフェ ニルアミン、ナフチルアミン等の芳香族アミン類を挙げ ることができる。

【0072】含窒素化合物(ロ)としては、例えば、エチレンジアミン、N,N,N',N'ーテトラメチルエチ レンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルアミン、2,2ーピス(4ーアミノフェニル)プロパン、2ー(3ーアミノフェニル)ー2ー(4ーアミノフェニル)プロパン、2ー(4ーアミノフェニル)プロパン、2ー(4ーアミノフェニル)プロパン、2ー(4ーアミノフェニル)ー2ー(3ーヒドロキシフェニル)プロパン、2ー(4ーアミノフェニル)ー2ー(4ーヒドロキシフェニル)プロパン、1,4ーピス〔1ー(4ーアミノフェニル)ー1ー50メチルエチル〕ベンゼン、1,3ーピス〔1ー(4ーア

ミノフェニル) -1-メチルエチル〕ベンゼン、ビス (2-ジメチルアミノエチル) エーテル、ピス(2-ジ エチルアミノエチル)エーテル等を挙げることができ る。含窒素化合物(ハ)としては、例えば、ポリエチレ ンイミン、ポリアリルアミン、2-ジメチルアミノエチ

ルアクリルアミドの重合体等を挙げることができる。 【0073】前記アミド基含有化合物としては、例え ば、N-t-プトキシカルポニルジ-n-オクチルアミ ン、N-t-プトキシカルボニルジ-n-ノニルアミ ン、N-t-プトキシカルポニルジ-n-デシルアミ ン、N-t-プトキシカルポニルジシクロヘキシルアミ ン、N-t-プトキシカルポニル-1-アダマンチルア ミン、N-t-プトキシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N, N-ジ-t-プトキシカルボ ニルー1-アダマンチルアミン、N, N-ジーt-プト キシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミ ン、N-t-プトキシカルポニル-4,4'-ジアミノ ジフェニルメタン、N, N' -ジ- t -プトキシカルボ ニルヘキサメチレンジアミン、N, N, N' N' ーテト ラーtープトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、 N, N'-ジーt-プトキシカルボニル-1, 7-ジア ミノヘプタン、N, N'ージーtープトキシカルボニル -1,8-ジアミノオクタン、N,N'-ジ-t-プト キシカルボニル-1, 9-ジアミノノナン、N, N'-ジー t ープトキシカルボニルー1,10ージアミノデカ ン、N, N'ージーtープトキシカルポニルー1, 12 ージアミノドデカン、N, N'ージー t ープトキシカル ボニル-4, 4'ージアミノジフェニルメタン、N-t ープトキシカルボニルベンズイミダゾール、N-t-ブ トキシカルポニル-2-メチルベンズイミダゾール、N 30 - t - プトキシカルボニル - 2 - フェニルベンズイミダ ゾール等のN-t-プトキシカルボニル基含有アミノ化 合物のほか、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、 N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メ チルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プ ロピオンアミド、ペンズアミド、ピロリドン、N-メチ ルピロリドン等を挙げることができる。

【0074】前記ウレア化合物としては、例えば、尿 素、メチルウレア、1,1-ジメチルウレア、1,3-ジメチルウレア、1,1,3,3-テトラメチルウレ ア、1,3-ジフェニルウレア、トリーn-ブチルチオ ウレア等を挙げることができる。前記含窒素複素環化合 物としては、例えば、イミダゾール、ペンズイミダゾー ル、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニ ルイミダゾール、N-t-プトキシカルポニル-2-フ エニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類; ピリジ ン、2-メチルピリジン、4-メチルピリジン、2-エ チルピリジン、4-エチルピリジン、2-フェニルピリ ジン、4-フェニルピリジン、2-メチル-4-フェニ ルピリジン、ニコチン、ニコチン酸、ニコチン酸アミ

ド、キノリン、4-ヒドロキシキノリン、8-オキシキ ノリン、アクリジン等のピリジン類;ピペラジン、1-(2-ヒドロキシエチル) ピペラジン等のピペラジン類 のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キノザリ ン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、3-ピペリジノ -1,2-プロパンジオール、モルホリン、4-メチル モルホリン、1, 4-ジメチルピペラジン、1, 4-ジ アザビシクロ[2.2.2] オクタン等を挙げることが できる。

28

【0075】これらの含窒素有機化合物のうち、含窒素 化合物(イ)、含窒素化合物(ロ)、含窒素複素環化合 物が好ましい。前記酸拡散制御剤は、単独でまたは2種 以上を混合して使用することができる。酸拡散制御剤の 配合量は、樹脂(A)100重量部に対して、通常、1 5 重量部以下、好ましくは10重量部以下、さらに好ま しくは5重量部以下である。この場合、酸拡散制御剤の 配合量が15重量部を超えると、レジストとしての感度 や露光部の現像性が低下する傾向がある。なお、酸拡散 制御剤の配合量が0.001重量部未満であると、プロ セス条件によっては、レジストとしてのパターン形状や 寸法忠実度が低下するおそれがある。

【0076】また、本発明の感放射線性樹脂組成物に は、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との接 着性等をさらに改善する作用を示す、酸解離性基を有す る脂環族添加剤を配合することができる。このような脂 環族添加剤としては、例えば、1-アダマンタンカルボ ン酸 t ープチル、1 ーアダマンタンカルボン酸 t ープト キシカルボニルメチル、1,3-アダマンタンジカルボ ン酸ジー t ープチル、1-アダマンタン酢酸 t ープチ ル、1-アダマンタン酢酸 t-プトキシカルボニルメチ ル、1,3-アダマンタンジ酢酸ジーt-プチル、2, 5-ジメチル-2, 5-ジ (アダマンチルカルボニルオ キシ) - n - ヘキサン等のアダマンタン誘導体類:デオ キシコール酸 t ープチル、デオキシコール酸 t ープトキ シカルボニルメチル、デオキシコール酸2-エトキシエ チル、デオキシコール酸2-シクロヘキシルオキシエチ ル、デオキシコール酸3-オキソシクロヘキシル、デオ キシコール酸テトラヒドロピラニル、デオキシコール酸 メバロノラクトンエステル等のデオキシコール酸エステ 40 ル類; リトコール酸 t - プチル、リトコール酸 t - ブト キシカルポニルメチル、リトコール酸 2 - エトキシエチ ル、リトコール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、リ トコール酸3-オキソシクロヘキシル、リトコール酸テ トラヒドロピラニル、リトコール酸メパロノラクトンエ ステル等のリトコール酸エステル類等を挙げることがで きる。これらの脂環族添加剤は、単独でまたは2種以上 を混合して使用することができる。脂環族添加剤の配合 量は、樹脂(A)100重量部に対して、通常、50重 量部以下、好ましくは30重量部以下である。この場 50 合、脂環族添加剤の配合量が50重量部を超えると、レ

ジストとしての耐熱性が低下する傾向がある。

【0077】また、本発明の感放射線性樹脂組成物に は、塗布性、現像性等を改良する作用を示す界面活性剤 を配合することができる。前記界面活性剤としては、例 えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキ シエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオ レイルエーテル、ポリオキシエチレンnーオクチルフェ ニルエーテル、ポリオキシエチレンn-ノニルフェニル エーテル、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリ エチレングリコールジステアレート等のノニオン系界面 10 活性剤のほか、以下商品名で、KP341(信越化学工 業(株)製)、ポリフローNo. 75, 同No. 95 (共栄社化学(株)製)、エフトップEF301,同E F303, 同EF352 (トーケムプロダクツ (株) 製)、メガファックスF171、同F173 (大日本イ ンキ化学工業(株)製)、フロラードFC430,同F C431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードA G710, サーフロンS-382, 同SC-101, 同 SC-102, 同SC-103, 同SC-104, 同S C-105, 同SC-106 (旭硝子 (株) 製) 等を挙 20 げることができる。これらの界面活性剤は、単独でまた は2種以上を混合して使用することができる。 界面活性 剤の配合量は、樹脂(A)、酸発生剤(B)および酸発 生剤(b)の合計100重量部に対して、通常、2重量 部以下である。さらに、前記以外の添加剤としては、ハ レーション防止剤、接着助剤、保存安定化剤、消泡剤等 を挙げることができる。

#### 【0078】組成物溶液の調製

本発明の感放射線性樹脂組成物は、普通、その使用に際 して、全固形分濃度が、通常、5~50重量%、好まし 30 くは10~25重量%となるように、溶剤に溶解したの ち、例えば孔径 0. 2 μm程度のフィルターでろ過する ことによって、組成物溶液として調製される。前記組成 物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、2-プタノン、2-ペンタノン、3-メチル-2-プタノ ン、2-ヘキサノン、4-メチル-2-ペンタノン、3 ーメチルー2ーペンタノン、3,3ージメチルー2ープ タノン、2-ヘプタノン、2-オクタノン等の直鎖状も しくは分岐状のケトン類;シクロペンタノン、3-メチ ルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-メチルシ 40 クロヘキサノン、2,6-ジメチルシクロヘキサノン、 イソホロン等の環状のケトン類;プロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノーnープロピルエーテルアセテート、プロピレング リコールモノーiープロピルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールモノー n - プチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールモノーi-ブチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノーsecープチル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノーt-50 ン酸アルキル類が好ましい。

プチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモ ノアルキルエーテルアセテート類;2-ヒドロキシプロ ピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシプロピオン酸 n-プロピル、2-ヒドロ キシプロピオン酸 i - プロピル、2 - ヒドロキシプロピ オン酸 n ープチル、2 ーヒドロキシプロピオン酸 i ーブ チル、2-ヒドロキシプロピオン酸sec-ブチル、2 ーヒドロキシプロピオン酸 t ープチル等の2-ヒドロキ シプロピオン酸アルキル類;3-メトキシプロピオン酸 メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキ シプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチ ル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類のほか、 【0079】nープロピルアルコール、iープロピルア ルコール、n-ブチルアルコール、t-ブチルアルコー ル、シクロヘキサノール、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノーnープロピルエーテル、エチ レングリコールモノーnープチルエーテル、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジ エチルエーテル、ジエチレングリコールジーn-プロピ ルエーテル、ジエチレングリコールジーnープチルエー テル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノーnープロピルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレン グリコールモノーnープロピルエーテル、トルエン、キ シレン、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3ーメチル酪酸メチル、3ーメトキシブチ ルアセテート、3-メチル-3-メトキシプチルアセテ ート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネー ト、3-メチル-3-メトキシプチルプチレート、酢酸 エチル、酢酸nープロピル、酢酸nープチル、アセト酢 酸メチル、アセト酢酸エチル、ピルビン酸メチル、ピル ビン酸エチル、N-メチルピロリドン、N, N-ジメチ ルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、ベン ジルエチルエーテル、ジーn-ヘキシルエーテル、ジエ チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ コールモノエチルエーテル、カプロン酸、カプリル酸、 1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコー ル、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチ ル、マレイン酸ジエチル、アープチロラクトン、炭酸エ チレン、炭酸プロピレン等を挙げることができる。

【0080】これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができるが、就中、直鎖状もしくは分岐状のケトン類、環状のケトン類、プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、2-ヒドロキシプロピオン酸アルキル類、3-アルコキシプロピオン酸アルキル類が好ましい。

#### 【0081】レジストパターンの形成方法

本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジ ストとして有用である。前記化学増幅型レジストにおい ては、露光により酸発生剤(B)あるいはそれと酸発生 剤(b)から発生した酸の作用によって、樹脂(A)中 の酸解離性基が解離して、カルボキシル基を生じ、その 結果、レジストの露光部のアルカリ現像液に対する溶解 性が高くなり、該露光部がアルカリ現像液によって溶 解、除去され、ポジ型のレジストパターンが得られる。 本発明の感放射線性樹脂組成物からレジストパターンを 10 形成する際には、組成物溶液を、回転塗布、流延塗布、 ロール塗布等の適宜の塗布手段によって、例えば、シリ コンウエハー、アルミニウムで被覆されたウエハー等の 基板上に塗布することにより、レジスト被膜を形成し、 場合により予め加熱処理(以下、「PB」という。)を 行ったのち、所定のレジストパターンを形成するように 該レジスト被膜に露光する。その際に使用される放射線 としては、使用される酸発生剤の種類に応じて、可視光 線、紫外線、遠紫外線、X線、荷電粒子線等を適宜選定 して使用されるが、ArFエキシマレーザー(波長19 3 nm) あるいはKrFエキシマレーザー(波長248 nm)で代表される遠紫外線が好ましく、特にArFエ キシマレーザー (波長193nm) が好ましい。本発明 においては、露光後に加熱処理(以下、「PEB」とい う。)を行うことが好ましい。このPEBにより、樹脂 (A) 中の酸解離性基の解離反応が円滑に進行する。P EBの加熱条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成に よって変わるが、通常、30~200℃、好ましくは5 0~170℃である。

【0082】本発明においては、感放射線性樹脂組成物 30 の潜在能力を最大限に引き出すため、例えば特公平6-12452号公報等に開示されているように、使用され る基板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成し ておくこともでき、また環境雰囲気中に含まれる塩基性 不純物等の影響を防止するため、例えば特開平5-18 8598号公報等に開示されているように、レジスト被 膜上に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技 術を併用することもできる。次いで、露光されたレジス ト被膜を現像することにより、所定のレジストパターン を形成する。現像に使用される現像液としては、例え ば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウ ム、けい酸ナトリウム、メタけい酸ナトリウム、アンモ ニア水、エチルアミン、n-プロピルアミン、ジエチル アミン、ジーnープロピルアミン、トリエチルアミン、 メチルジエチルアミン、エチルジメチルアミン、トリエ タノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド、ピロール、ピペリジン、コリン、1,8-ジアザビ シクロー [5.4.0] - 7 - ウンデセン、1,5-ジ アザビシクロー [4.3.0] -5-ノネン等のアルカ

液が好ましい。前記アルカリ性水溶液の濃度は、通常、10重量%以下である。この場合、アルカリ性水溶液の 濃度が10重量%を超えると、非露光部も現像液に溶解 するおそれがあり好ましくない。

32

【0083】また、前記アルカリ性水溶液からなる現像 液には、例えば有機溶媒を添加することもできる。前記 有機溶媒としては、例えば、アセトン、メチルエチルケ トン、メチルiープチルケトン、シクロペンタノン、シ クロヘキサノン、3-メチルシクロペンタノン、2,6 ージメチルシクロヘキサノン等のケトン類;メチルアル コール、エチルアルコール、n-プロピルアルコール、 i-プロピルアルコール、n-ブチルアルコール、t-ブチルアルコール、シクロペンタノール、シクロヘキサ ノール、1,4-ヘキサンジオール、1,4-ヘキサン ジメチロール等のアルコール類; テトラヒドロフラン、 ジオキサン等のエーテル類;酢酸エチル、酢酸 n - ブチ ル、酢酸i-アミル等のエステル類;トルエン、キシレ ン等の芳香族炭化水素類や、フェノール、アセトニルア セトン、ジメチルホルムアミド等を挙げることができ る。これらの有機溶媒は、単独でまたは2種以上を混合 して使用することができる。有機溶媒の使用量は、アル カリ性水溶液に対して、100容量%以下が好ましい。 この場合、有機溶媒の使用量が100容量%を超える と、現像性が低下して、露光部の現像残りが多くなるお それがある。また、アルカリ性水溶液からなる現像液に は、界面活性剤等を適量添加することもできる。なお、 アルカリ性水溶液からなる現像液で現像したのちは、一 般に、水で洗浄して乾燥する。

[0084]

【発明の実施の形態】以下、実施例を挙げて、本発明の 実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明 は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。こ こで、部は、特記しない限り重量基準である。実施例お よび比較例における各測定・評価は、下記の要領で行っ た。

Mw:東ソー(株) 製GPCカラム(G2000HXL2 本、G3000HXL1本、G4000HXL1本)を用い、流量1.0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により測定した。

放射線透過率:組成物溶液を石英ガラス上にスピンコートにより塗布し、90 ℃に保持したホットプレート上で60 秒間 PB を行って形成した膜厚 $0.4\mu$  mのレジスト被膜について、波長 193 n mにおける吸光度から、放射線透過率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とした。

を、各基板上にスピンコートにより塗布し、ホットプレ ート上にて、表2に示す条件でPBを行って形成した膜 厚0. 4μmのレジスト被膜に、(株) ニコン製ArF エキシマレーザー露光装置(レンズ開口数0.55、露 光波長193nm)により、マスクパターンを介して露 光した。その後、表2に示す条件でPEBを行ったの ち、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロ キシド水溶液(実施例1~7)または2.38×1/5 0 重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶 液(比較例1)により、25℃で1分間現像し、水洗 し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。 このとき、線幅 $0.16\mu$ mのライン・アンド・スペー スパターン(1L1S)を1対1の線幅に形成する露光 量を最適露光量とし、この最適露光量を感度とした。

ドライエッチング耐性:組成物溶液をシリコーンウエハ 一上にスピンコートにより塗布し、乾燥して形成した膜 厚0: 5μmのレジスト被膜に対して、PMT社製ドラ イエッチング装置 (Pinnacle8000) を用い、エッチング 20 ガスをCF、とし、ガス流量75sccm、圧力2.5 mTorr、出力2,500Wの条件でドライエッチン グを行って、エッチング速度を測定し、比較例1の組成 物溶液から形成したレジスト被膜のエッチング速度を 1. 0として、相対エッチング速度を評価した。エッチ

【0085】解像度:最適露光量で解像される最小のレ

ジストパターンの寸法を、解像度とした。

パターン形状:線幅0.16μmのライン・アンド・ス ペースパターン(1L1S)の方形状断面の下辺寸法L L と上下辺寸法L. とを走査型電子顕微鏡により測定 し、0.85≦L<sub>1</sub>/L<sub>1</sub>≤1を満足し、かつパターン

形状が裾を引いていない場合を、パターン形状が"良

ング速度が小さいほど、ドライエッチング耐性に優れる

好"であるとした。

ことを意味する。

【0086】合成例1

下記式(6)の化合物30gとメタクリル酸2-メチル -2-アダマンチル20gを、テトラヒドロフラン50 gに溶解して均一溶液としたのち、窒素を30分間吹き 込み、ついで重合開始剤としてアゾピスイソプチロニト リル3gを加え、65℃に加熱した。その後、同温度に 温まで冷却し、テトラヒドロフラン50gを加えて希釈 したのち、n-ヘキサン1,000ミリリットル中に投 入し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得 た。

[0087]

【化22】

【0088】この樹脂は、Mwが12,000であり、 10 式(6)の化合物およびメタクリル酸2-メチル-2-アダマンチルに由来する各繰り返し単位の含有率がそれ ぞれ60モル%および40モル%の共重合体であった。 この樹脂を、樹脂 (A-I) とする。

【0089】合成例2

前記式(6)の化合物28g、メタクリル酸2-メチル -2-アダマンチル21gおよびN, N-ジメチルアク リルアミド1gを、テトラヒドロフラン50gに溶解し て均一溶液としたのち、窒素を30分間吹き込み、つい で重合開始剤としてアゾビスイソプチロニトリル3gを 加え、65℃に加熱した。その後、同温度に保って6時 間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室温まで冷却 し、テトラヒドロフラン50gを加えて希釈したのち、 n-ヘキサン1,000ミリリットル中に投入し、析出 した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得た。この樹 脂は、Mwが13,000であり、式(6)の化合物、 メタクリル酸 2 - メチル-2-アダマンチルおよびN, Nージメチルアクリルアミドに由来する各繰り返し単位 の含有率がそれぞれ55モル%、40モル%および5モ ル%の共重合体であった。この樹脂を、樹脂 (A-2) と 30 する。

【0090】合成例3

前記式(6)の化合物15g、メタクリル酸2-メチル -2-アダマンチル20gおよびアクリル酸3-ヒドロ キシアダマンチル15gを、テトラヒドロフラン50g に溶解して均一溶液としたのち、窒素を30分間吹き込 み、ついで重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリ ル3gを加え、65℃に加熱した。その後、同温度に保 って6時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室温 まで冷却し、テトラヒドロフラン50gを加えて希釈し 保って6時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室 40 たのち、n-ヘキサン1,000ミリリットル中に投入 し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得 た。この樹脂は、Mwが11,000であり、式(6) の化合物、メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル およびアクリル酸3-ヒドロキシアダマンチルに由来す る各繰り返し単位の含有率がそれぞれ30モル%、40 モル%および30モル%の共重合体であった。この樹脂 を、樹脂 (A-3) とする。

【0091】合成例4

前記式(6)の化合物30gとアクリル酸2-ノルボル 50 ニルー2-n-プロピル20gを、テトラヒドロフラン

50gに溶解して均一溶液としたのち、窒素を30分間 吹き込み、ついで重合開始剤としてアゾビスイソブチロ ニトリル3gを加え、65℃に加熱した。その後、同温 度に保って6時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液 を室温まで冷却し、テトラヒドロフラン50gを加えて 希釈したのち、n-ヘキサン1,000ミリリットル中 に投入し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂 を得た。この樹脂は、Mwが12,600であり、式 (6) の化合物およびアクリル酸2-ノルボルニル-2

-n-プロピルに由来する各繰り返し単位の含有率がそ 10 れぞれ60モル%および40モル%の共重合体であっ た。この樹脂を、樹脂(A-4)とする。

#### 【0092】合成例5

前記式(6)の化合物22g、メタクリル酸2-メチル -2-アダマンチル18g、無水マレイン酸4gおよび ノルボルネン6gを、テトラヒドロフラン50gに溶解 して均一溶液としたのち、窒素を30分間吹き込み、つ いで重合開始剤としてアゾビスイソプチロニトリル3g を加え、65℃に加熱した。その後、同温度に保って6 時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室温まで冷 20 却し、テトラヒドロフラン50gを加えて希釈したの ち、n-ヘキサン1,000ミリリットル中に投入し、 析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得た。こ の樹脂は、Mwが6, 300であり、式(6)の化合 物、メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、無水 マレイン酸およびノルボルネンに由来する各繰り返し単 位の含有率がそれぞれ40モル%、30モル%、15モ ル%および15モル%の共重合体であった。この樹脂 を、樹脂 (A-5) とする。

#### 【0093】合成例6

前記式(6)の化合物25gおよびメタクリル酸2-メ チル-2-アダマンチル25gを、テトラヒドロフラン 50gに溶解して均一溶液としたのち、窒素を30分間 吹き込み、ついで重合開始剤としてアゾビスイソブチロ ニトリル3gを加え、65℃に加熱した。その後、同温 度に保って6時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液 を室温まで冷却し、テトラヒドロフラン50gを加えて 希釈したのち、n-ヘキサン1,000ミリリットル中 に投入し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂 を得た。この樹脂は、Mwが11,000であり、式 (6) の化合物およびメタクリル酸2-メチル-2-ア ダマンチルに由来する各繰り返し単位の含有率がそれぞ

#### 【0094】合成例7

の樹脂を、樹脂 (A-6) とする。

前記式(6)の化合物15g、メタクリル酸2-メチル - 2-アダマンチル22.5gおよびアクリル酸3-ヒ ドロキシアダマンチル12.5gを、テトラヒドロフラ ン50gに溶解して均一溶液としたのち、窒素を30分 間吹き込み、ついで重合開始剤としてアゾビスイソプチ 50 タンスルホネート

れ50モル%および50モル%の共重合体であった。こ

ロニトリル3gを加え、65℃に加熱した。その後、同 温度に保って6時間加熱攪拌した。反応終了後、反応溶 液を室温まで冷却し、テトラヒドロフラン50gを加え て希釈したのち、n-ヘキサン1,000ミリリットル 中に投入し、析出した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹 脂を得た。この樹脂は、Mwが11,000であり、式 (6) の化合物、メタクリル酸2-メチル-2-アダマ ンチルおよびアクリル酸 3 - ヒドロキシアダマンチルに 由来する各繰り返し単位の含有率がそれぞれ30モル %、45モル%および25モル%の共重合体であった。 この樹脂を、樹脂 (A-7) とする。

#### 【0095】合成例8

前記式(6)の化合物28.75g、メタクリル酸2-メチルー2-アダマンチル28.75gおよびメタクリ ル酸2.5gを、テトラヒドロフラン50gに溶解して 均一溶液としたのち、窒素を30分間吹き込み、ついで 重合開始剤としてアゾビスイソプチロニトリル3gを加 え、65℃に加熱した。その後、同温度に保って6時間 加熱攪拌した。反応終了後、反応溶液を室温まで冷却 し、テトラヒドロフラン50gを加えて希釈したのち、 n-ヘキサン1,000ミリリットル中に投入し、析出 した白色粉体をろ別し、乾燥して、樹脂を得た。この樹 脂は、Mwが13,000であり、式(6)の化合物、 メタクリル酸2-メチル-2-アダマンチルおよびメタ クリル酸に由来する各繰り返し単位の含有率がそれぞれ 47.5モル%、47.5モル%および5モル%の共重 合体であった。この樹脂を、樹脂(A-8)とする。

【0096】実施例1~12および比較例1

表1に示す成分からなる各組成物溶液について、各種評 30 価を行った。評価結果を、表3に示す。表1における重 合体 (A-1)~ (A-8)以外の成分は、以下の通りである。 他の樹脂

a-l: メタクリル酸 t ープチル/メタクリル酸メチル /メタクリル酸共重合体(共重合モル比=40/40/ 20), Mw = 20, 000)

#### 酸発生剤(B)

B-1:1-(4-n-プトキシ-1-ナフチル)テトラ ヒドロチオフェニウムノナフルオローnープタンスルホ

40 B-2:1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオローnーブ タンスルホネート

B-3:1-(4-n-プトキシ-1-ナフチル)テトラ ヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタンスル ホネート

#### 酸発生剤(b)

b-1: トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンス ルホネート

b-2: トリフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブ

b-3: ピス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムノ ナフルオローnープタンスルホネート

b-4: ノナフルオロ-n-プタンスルホニルビシクロ[ 2. 2. 1  $] \land 7 \land -5 - x \lor -2$ ,  $3 - y \lor y \lor x \lor + y$ イミド

#### 【0097】酸拡散制御剤

C-1: トリーn-オクチルアミン

C-2: メチルジシクロヘキシルアミン

C-3:3-ピペリジノ-1,2-プロパンジオール

C-4: N-t-プトキシカルボニルジシクロヘキシルア 10 ート

C-5: N-t-プトキシカルポニル-2-フェニルペン

ズイミダゾール

他の添加剤

D-I: デオキシコール酸 t - プチル

D-2:1, 3-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-ブチ

D-3: デオキシコール酸 t - ブトキシカルボニルメチル

溶剤

E-1:2-ヘプタノン

E-2:シクロヘキサノン

E-3: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ

E-4:3-エトキシプロピオン酸エチル

[0098]

【表1】

#### 表 1

	樹脂 (部)	酸発生剤(B) (部)	B (部)	他の添加剤 (部)	海 剤 (部)
実施例1	A-1 (100)	B-1 (2.0) b-1 (L.0)	C-1 (0, 10)		E-1 (530)
	A-1 (80) A-2 (10)	B-1 (3,0)	C-4 (0.05)	D-1 (10)	E-1 (430) E-2 (100)
実施例3	A-3 (95)	B-2 (2.0) b-2 (2.0)	C-2 (0, 10)	D-2 (5)	E-1 (430) E-4 (100)
	A-2 (10) A-3 (80)	B-3 (3.0) b-3 (2.0)	C-3 (0, 10)	D-3 (10)	E-8 (530)
実施例5	A-4 (100)	B-1 (2.0) b-4 (3.0)	C-5 (0,05)		E-1 (530)
実施列6	A-5 (90)	B-3 (2.0) b-4 (2.0)	C-5 (0,05)	D-3 (10)	E-1 (430) E-2 (100)
	A-2 (10) A-5 (80)	B-2 (3.0) b-4 (2.0)	C-3 (0,05) C-5 (0,03)	D-2 (10)	E-3 (430) E-4 (100)
実施例8	A-6 (90)	B-3 (5,0)	C-5 (0, 10)	D-3 (10)	E-3 (530)
実施例9	A-7 (100)	B-2 (5,0)	C-5 (0, 10)		E-1 (530)
実施例10	A-8 (90)	B-3 (5,0)	C-5 (0, 10)	D-3 (10)	E-3 (530)
実施例11	A-7 (100)	B-2 (4.0) b-2 (1.0)	C-5 (0, 10)		E-1 (430) E-2 (100)
実施例12	A-1 (90)	B-3 (5,0)	C-5 (0, 10)	D-3 (10)	E-3 (530)
比較到1	a-1 (90)	b-1 (2,0)	C-1 (0,05)	D-1 (10)	E-1 (530)

[0099]

\_表\_2

	レジスト被膜 の腹厚(μm)	基板	РВ		PEB	
	OBSA (PIII)		温度 (°C)	時間 (秒)	湿度 (℃)	時間 (秒)
実施例1	0. 4	ARC	130	90	140	90
実施例2	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施例3	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施例4	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施列5	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施例6	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施例7	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施列8	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施例9	0.4	ARC	130	90	140	90
実施例10	0, 4	ARC	130	90	140	90
実施例11	Q 4	ARC	130	90	140	90
実施例12	0, 4	ARC	130	90	140	90
比较到 1	0.4	ARC	130	90	140	90

[0100]

【表3】

表 3

	放射線透過率 (193mm %)	感 度 (J/m²)	解像度 (μm)	ドライエッチング <b>耐性</b>	パターン 形状
実施例1	7 2	8 9	0. 15	0. 8	良好
実施例2	7 4	9 5	0. 15	0. 6	良好
実施列3	6 9	7 9	0. 15	0. 7	良好
実施例4	7 0	8 5	0. 15	0, 8	良好
実施例5	6 9	8 1	0. 15	0. 5	與
実施例6	7 3	8 6	0. 15	0. 7	良好
実施例7	7 2	9 2	0. 15	0. 6	良好
実施例8	7 1	9 0	0, 15	0.8	良好
実施例 9	6 8	79	0. 15	0. 7	良好
実施例10	7 1	90	0. 15	0. 8	娘
実施例11	6 7	8 1	0. 15	0. 7	独
実施例12	7 0	9 5	0. 14	0. 8	良好
比較例1	6 1	150	0. 18	1. 0	良好

#### [0101]

【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物は、活性 光線、例えばKrFエキシマレーザー(波長248 n m) あるいはArFエキシマレーザー(波長193 n m) に代表される遠紫外線に感応する化学増幅型レジス トとして、特に放射線に対する透明性が高いため、解像

度が高く、かつ優れたドライエッチング耐性を有するとともに、感度、パターン形状等にも優れており、また基板に対する接着性も良好であり、今後さらに微細化が進30 行すると予想される集積回路素子の製造に極めて好適に使用することができる。

#### フロントページの続き

(72)発明者 片岡 敦子

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

(72)発明者 梶田 徹

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA09 AB16 AC04 AC08 AD03 BE07 BE10

BG00 CB14 CB41

4J100 AL02Q AL08P AL08Q BA11P BC01Q BC53P CA03 DA01 DA39 DA61 EA01 JA38

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.